EUROPEAN PATENT OFFICE

68185 ED

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

07055727

PUBLICATION DATE

03-03-95

APPLICATION DATE

20-08-93

APPLICATION NUMBER

05227895

APPLICANT: RIGAKU CORP;

INVENTOR: OKANDA HITOSHI;

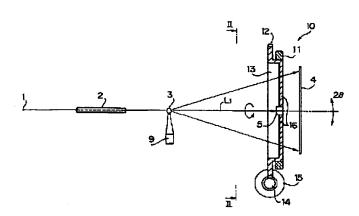
INT.CL.

G01N 23/20

TITLE

X-RAY DEVICE WITH DIRECT BEAM

STOPPER



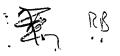
ABSTRACT: PURPOSE: To enable the image sensing of a Laue SPOT in a low angular region related to the angle of diffraction 20, and to prevent the generation of a dead angle resulting from a support member supporting a direct beam stopper.

The state of the state of

CONSTITUTION: A sample 3 is irradiated with X-rays, and an X-ray film 4 is irradiated with X-rays diffracted by the sample 3 while incident on the X-ray film 4 of direct beams transmitted through the sample 3 is interrupted by a direct beam stopper 5 in a Laue camera. Two stopper support members 16 supporting the direct beam stopper 5 is formed of a material difficult to be deformed, and the stopper support members 16 are rotated centering around an optical axis L1 by a motor 15, a worm 14 and a gear 12. The generation of a dead angle is prevented by tuning the stopper support members 16.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)





(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-55727

(43)公開日 平成7年(1995) 3月3日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 1 N 23/20

7172-2J

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特段平5-227895

(71)出願人 000250339

理学電機株式会社

(22)出願日

平成5年(1993)8月20日

東京都昭島市松原町3丁目9番12号

(72)発明者 大神田 等

東京都昭島市松原町3-9-12 理学電機

株式会社拝島工場内

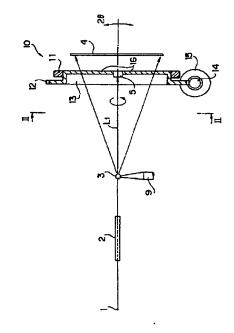
(74)代理人 弁理士 横川 邦明

(54)【発明の名称】 ダイレクトピームストッパを備えたX線装置

(57) 【要約】

【目的】 回折角度 2 θ に関する低角度領域におけるラ ウエ図形の撮像を可能とし、しかもダイレクトビームス トッパを支持する支持部材に起因するデッドアングルの 発生を防止する。

【構成】 試料3にX線を照射し、試料3で回折した回 折X線をX線フィルム4に照射すると共に、試料3を透 過するダイレクトピームがX線フィルム4に入射するこ とをダイレクトピームストッパ5によって遮断するよう にしたラウエカメラ。ダイレクトピームストッパ5を支 持する2個のストッパ支持部材16を変形し難い材料に よって形成し、モータ15、ウオーム14、ギヤ12に よってストッパ支持部材16を光軸L1を中心として回 転させる。ストッパ支持部材16を回転させることによ り、デッドアングルの発生を防止する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 試料にX線を照射し、その試料で回折した回折X線をX線感応部材に照射すると共に、その試料を透過するダイレクトビームがX線感応部材に入射することをダイレクトビームストッパによって遮断するようにしたX線装置において、

変形し難い材料によって形成されていて、ダイレクトビ ームストッパを支持するストッパ支持部材と、

ダイレクトピームストッパを中心としてストッパ支持部材を回転させる支持部材回転手段とを有することを特徴 10 とするダイレクトビームストッパを備えたX線装置。

【請求項2】 回折X線がX線感応部材に照射される時間内にストッパ支持部材が整数回転することを特徴とする請求項1記載のダイレクトピームストッパを備えたX線装置。

【請求項3】 ストッパ支持部材は、ダイレクトピームストッパを中心とする扇型形状に形成されることを特徴とする請求項1記載のダイレクトピームストッパを備えたX線装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ラウエカメラ等のようなダイレクトピームストッパを備えたX線装置に関する。

[0002]

【従来の技術】測定対象である試料に関してそれが単結晶であるか、多結晶であるか又は非晶質であるか等を判定、すなわち結晶状態を判定したり、又は単結晶試料に配向があるかどうか等を判定したりするために、ラウエカメラによって撮影されたラウエ図形上のラウエ斑点を 30 観察したり、ラウエ図形上のデバイ環を観察したりする X線測定法が知られている。

【0003】このようなラウエカメラとして、従来、図3に示す構成のものが知られている。このラウエカメラでは、X線源1から放射されたX線(通常は連続X線)をコリメータ2によってビーム幅を絞って試料3に照射し、その試料3で回折した回折X線をX線感応部材4、例えばX線フィルムに照射して、そのX線感応部材4上にラウエ図形を撮像する。そしてこのとき、X線感応部材4の前にダイレクトビームストッパ5を配置し、試料3を透過するダイレクトビームがX線感応部材4に入射することをそのダイレクトビームストッパ5によって遮断するようにしている。ダイレクトピームストッパ5は、フレーム6の上縁に支持されて垂下するストッパ支持部材7の下端に固定されて、X線感応部材4の前面の中央部に位置している。

【0004】また従来、図4に示すような構成を有する ラウエカメラも知られている。このラウエカメラでは、 X線感応部材4の前方位置にX線を透過し易い高分子フィルム8を配置し、その高分子フィルム8の中央部にダ イレクトピームストッパ5を固着してある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながらストッパ支持部材?を用いてダイレクトビームストッパ5を支持するようにした従来のラウエカメラ(図3)においては、試料3からの回折X線がストッパ支持部材?によって遮られてX線感応部材4に入射することができず、よってその部分に対応したラウエ図形が得られない、すなわちデッドアングルが生じるという問題点があった。

【0006】また、高分子フィルム8によってダイレクトピームストッパ5を支持するようにしたラウエカメラ(図4)においては、試料3からの回折X線が高分子フィルム8に入射したときに散乱X線が発生してそれがX線感応部材4に入射し、その結果、ラウエ図形が不明瞭になるという問題があった。

【0007】また図4の従来装置では、高分子フィルム8の剛性が比較的低いので、ダイレクトピームストッパ5の中心軸線を回折X線の光軸に対して正確に一致させることができず、どうしてもダイレクトピームストッパ5が回折X線の光軸に対して傾いてしまうという問題があった。この問題が生じると、ダイレクトピームを適較するという所期の目的が達成できないおそれがある。これを回避するため図4の装置においては、通常、ダイレクトピームストッパ5の外径を大きくして、ダイレクトピームを確実に遮蔽するようにしている。しかしながらそのような構造を採用すると、回折角度20に関する低角度領域において回折X線像が得られないという問題が発生する。

【0008】本発明は、上記の各問題点を解消するためになされたものであって、回折角度 2θ に関する低角度領域におけるX線像の損像を可能とし、しかも上記のデッドアングルや、散乱X線によるX線図形の劣化を解消することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記の目的を解消するため本発明に係るX線装置は、変形し難い材料によって形成されていてダイレクトビームストッパを支持するストッパ支持部材と、ダイレクトビームストッパを中心としてそのストッパ支持部材を回転させる支持部材回転手段とを有することを特徴としている。

【0010】ストッパ支持部材の回転速度は、回折X線がX線感応部材に照射される時間内にそのストッパ支持部材が整数回転するような速度に設定することが望ましい。また、ストッパ支持部材の形状は、必ずしも特定の形状に限定されないが、ダイレクトビームストッパを中心として外方へ向かうに従って開く形状の、いわゆる扇型形状に設定することが望ましい。

[0011]

X 級感応部材 1 の前方位置に X 線を透過し易い高分子フ 【作用】変形し難い材料によって形成されたストッパ支ィルム 8 を配置し、その高分子フィルム 8 の中央部にダ 50 持部材によってダイレクトビームストッパを支持するよ

うにしたので、ダイレクトピームストッパの中心軸線を 正確にX線光軸に一致させた状態でダイレクトビームス トッパを安定して支持できる。その結果、ダイレクトビ ームストッパの外径を小さくしても確実にダイレクトビ ームを遮蔽できる。ダイレクトピームストッパの外径を 小さくすることにより、回折角度2θに関する低角度領 域のX線像を得ることができる。

【0012】また、X線回折測定の最中にストッパ支持 部材を回転させるようにしたので、X線感応部材上にス トッパ支持部材に起因するデッドアングルが発生するこ 10 ともなくなる。

[0013]

【実施例】図1は、本発明に係るX線装置の一実施例で あるラウエカメラを示している。このラウエカメラは、 連続X線を発生するX線源1と、内部に円形状のピンホ ールを備えたコリメータ2と、平行移動及びアーク運動 が可能なクロスゴニオメータ9上に固着された試料3 と、そしてX線フィルムその他のX線感応部材4とを有 している。試料3とX線感応部材4との間には、ダイレ クトピームストッパ・ユニット10が配設されている。 【0014】ダイレクトピームストッパ・ユニット10 は、図2にも示すように、外形形状が方形状であってそ の内部に円形穴を備えた支持フレーム11と、支持フレ ーム11の内部円形穴にはめ込まれていて外周にギヤ1 2が形成された回転盤13と、回転盤13のギヤ12に 噛み合うウオーム14と、そしてそのウオーム14を回 転駆動するモータ15とを有している。

【0015】回転盤13は支持フレーム11に対して回 転自在に嵌合している。図2に示すように、回転盤13 は円形リング状に形成されていて、その内部はほとんど 30 空間になっており、そのリング状の枠部分から2個のス トッパ支持部材16が半径方向内側へ延びている。これ らの支持部材16は比較的剛性が高くて変形し難い材料 によって形成されていて、それらの先端にダイレクトビ ームストッパ5が固定され支持されている。X線感応部 材4は、回転盤13内の空間部分の背後に配置されてい る。

【0016】なお本実施例では、ストッパ支持部材16 がダイレクトピームストッパ5に関して対称の位置に2 個設けられ、そして各ストッパ支持部材16はダイレク トピームストッパ5を中心として外部へ向かうに従って 広がる形状の、いわゆる扇型形状に形成されている。

【0017】本発明に係るラウエカメラは以上のように 構成されているので、測定が開始されると、図1におい て、X線源1から放射されたX線がコリメータ2によっ てコリメート、すなわちピーム幅を狭められて試料3に 照射される。このとき、試料3に入射したX線と試料3 の結晶格子面との間で周知のブラッグ条件が満足される と、X線の回折が生じる。この回折X線はダイレクトビ ームストッパ・ユニット10内の空間部を通過してX線 50 ームストッパの外径を小さく形成できる。その結果、回

感応部材4に入射し、X線像、すなわちラウエ図形を形 成する。

【0018】試料3を透過するダイレクトピームはダイ レクトピームストッパ5によってその進行を阻止され て、X線感応部材4には入射しない。ダイレクトビーム ストッパ5を支持するストッパ支持部材16は変形し難 い材料によって形成されているので、ダイレクトピーム ストッパ5の中心軸線は正確にX線光軸L1に一致した 状態で安定して支持される。従って、本実施例ではダイ レクトピームストッパ5の外径を小さく設定しても十分 確実にダイレクトピームの遮断処理を実行できる。そし て、ダイレクトビームストッパ5の外径をそのように小 さく形成することにより、回折角度 2θ に関する低角度 領域においてX線感応部材4へ回折X線を導くことが可 能となり、よって低角度領域内のX線像、すなわちラウ 工図形を得ることができる。

【0019】 X線源1から試料3へのX線の照射、すな わち試料3からX線感応部材4への回折X線の照射は所 定の測定時間、例えば1000秒間、連続して実行され 20 る。この測定時間中、ダイレクトピームストッパ・ユニ ット10内の回転盤13はモータ15によって駆動され て回転するウオーム14によって駆動されて、回折X線 の光軸L1を中心として回転する。従って、ストッパ支 持部材16は特定の角度位置に静止しないので、全ての 回折X線がX線感応部材4へ導かれ、その結果デッドア ングル、すなわちX線像の欠落部分が発生することがな い。なお、X線回折測定の測定時間中、各ストッパ支持 部材16を整数回転させるように設定しておくと、精度 の高いラウエ図形を得ることができる。これは、X線回 折測定の開始時におけるストッパ支持部材16の位置と X線回折測定の終了時におけるストッパ支持部材16の 位置とを常に同じ位置に整合させて、測定のパラツキを 抑えるためである。

【0020】以上、1つの実施例を上げて本発明を説明 したが、本発明はその実施例に限定されるものでなく、 請求の範囲に記載した技術的範囲内で種々に改変でき る。

【0021】例えば、本発明が適用できるX線装置はラ ウエカメラに限られず、ダイレクトピームをダイレクト ピームストッパによって遮断するようにした全てのX線 装置に適用できる。また、ストッパ支持部材16の数 は、1個又は3個以上であてっも良い。また、ストッパ 支持部材16の形状を、図3に符号7で示すような、直 線形状にすることもできる。

[0022]

【発明の効果】本発明によれば、変形し難い材料によっ て形成されたストッパ支持部材によってダイレクトピー ムストッパを支持するようにしたので、ダイレクトピー ムストッパを安定して支持でき、従って、ダイレクトビ 5

折角度 2θ に関する低角度領域におけるX線像を得ることができる。

【0023】また、X線回折測定の間、ストッパ支持部材を回転させるようにしたので、X線像にデッドアングル、すなわち欠落部分が生じない。

【0024】請求項2記載のX線装置によれば、X線回 折測定の開始時におけるストッパ支持部材の位置とX線 回折測定の終了時におけるストッパ支持部材の位置とを 常に同じ位置に整合させることができるので、測定のバ ラツキを抑えることができる。

【0025】請求項3記載のX線装置によれば、ストッパ支持部材によって進られる回折X線の領域が、ダイレクトビームストッパを中心とする半径方向に関して均一になるので、より一層信頼性の高いX線回折測定を行うことができる。

[0026]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るX線装置の一実施例であるラウエ

カメラを示す正面断面図である。

【図2】図1におけるII-II線に従った正面図である。

【図3】従来のラウエカメラの一例を示す斜視図である。

【図4】従来のラウエカメラの他の一例を示す斜視図である。

【符号の説明】

3 試料

10 4 X線感応部材

5 ダイレクトビームストッパ

10 ダイレクトビームストッパ・ユニット

12 ギヤ

13 回転盤

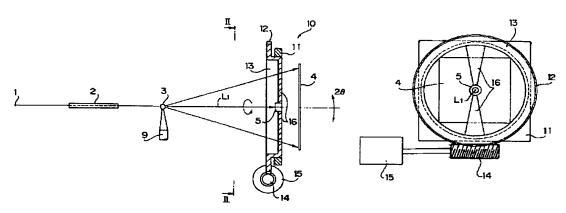
14 ウオーム

15 モータ

16 ストッパ支持部材

【図1】







【図4】

